

近常压 X 射线光电电子能谱及扫描隧道显微镜联用系统



型号	NAP-SPM & NAP-XPS
仪器指标	超高真空： $<5 \times 10^{-10}$ mbar； X 射线源：单色化 Al $K\alpha$ ； XPS 能量分辨率： <0.5 eV；
分析能力	近常压条件下对样品原位地进行成分以及形貌分析
仪器特色	高低温、高压气体原位反应池，低温-120°C至 600°C，压力： UHV 至 25 mbar； 扫描隧道显微镜：原位反应池，高温 500°C，低温-120°C，原子 分辨，快速成像。